

LAM U3 – 光斑质量分析仪

产品特点:

- 可安装在工作平面上进行高功率激光光斑分析。
- 内置风冷采样器。
- 支持USB3.0接口, 采样区域大, 分辨率高(2.35 M像素)。
- 用于脉冲或连续激光器的12位数字输出。
- 曝光时间可调。
- 触发延迟可调。
- 配套软件支持沿机器Z轴上的M平方因子测量和焦深计算。
- 可替换的衰减片。



在最关键的工作平面上测量光斑质量!

规格参数

可测光斑尺寸	ø60 微米- ø6 毫米
光谱范围	350 – 1310 纳米
功率范围@900/1070	连续激光1-2500 W, 脉冲激光1-1000 W
最大功率密度	100,000 W/cm ² (详情请咨询厂家)
分散到收集器的功率	输入的90%
功率测量	需要用户标定参考值
增益	1-24 dB
动态范围	60 dB 不含衰减片
快门速度	39 微秒至 20 秒
可换衰减片	-镜面衰减片 -ND100 -ND200 -ND1000
输入平面到传感器的光学距离(工作台水平面l)	40.7 ± 0.2 毫米
最大BPP	最大输入角 25 度
分辨率(竖直×水平像素数)	1920 x 1200

像素尺寸	5.86 微米x 5.86 微米
位置精度	± 15 微米
位置分辨率	1 微米
帧率	40 帧每秒(8 位)
探测器响应区域	11.34 x 7.13毫米
接口	USB 3.0, windows XP/7/8/10 (32 & 64 位)
像素位深	8/12 位
同步方式	• 软件 • 硬件(外部触发信号)
曝光控制	可在程序界面设置
器件大小(长×宽×高)	147 x 105 x 48毫米
电源要求	~2 W(通过USB 3.0 接口)
重量(标配)	传感器加数据线约1500克
机械接口	安装孔: 2 个同心对位M4螺孔, 深6毫米
冷却条件	6-8 Bar的压缩空气
运行温度	0° – 35° C

订购信息:

LAM-U3光斑分析仪: 产品包含一个支持350 – 1310 纳米波长测量的相机, 内置装有高功率衰减片的电动衰减片转轮以及固定用转接头, 一套可更换的衰减片, USB3.0数据线, 配套软件, 装有用户手册的光盘或U盘, 和一个便携包。

注意: 设备在进行高功率曝光时应小心操作, 连续曝光时间不能超过5秒。

DUMA OPTRONICS LTD.



海纳光学有限公司
HIGHLIGHT OPTICS CO., LTD.

Tel: 0755-84870203 www.highlightoptics.com
E-mail: sales@highlightoptics.com